

DHD-120935

证书号第 1843464 号



发明专利证书

发明名称：一种干涉成像光谱仪的高光谱数据坏点检测与修正方法

发明人：王超；施润和；吴昀昭；陈韵竹；沈仙霞；李镜尧；景卓鑫
翟天勇

专利号：ZL 2013 1 0101010.X

专利申请日：2013年03月26日

专利权人：华东师范大学

授权公告日：2015年11月18日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月26日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

